厚度、成分都好测的光谱仪

SPECTROMETER WITH EASY MEASUREMENT OF THICKNESS AND COMPOSITION

扫一扫
了解更多

江苏一六仪器有限公司

地址：江苏省昆山市玉山镇成功路168号

地址：深圳市宝安区沙井全至科技创新园

邮箱：sales@16elite.com

网址：www.16elite.com

服务热线：400-850-1617

注：此样品所有信息仅供参考，如有变动恕不另行通知

版本号：ELITE20220117

一六仪器
Elite Instruments

多功能全自动XRF

——XAD/XAD-200

- 涂镀层分析
- RoHS检测
- 地矿全元素分析
- 贵金属检测

本企业执行ISO9001:2015国际质量认证体系

仪器简介

INTRODUCTION OF INSTRUMENT

多功能全自动XRF——XAD/XAD-200为全新上照式设计，搭载全自动移动平台和影像识别功能，既能检测纳米级厚度、微小样品和凹槽异形件的膜厚，也可满足微区RoHS检测及多元素成分分析，先进的算法及解谱技术解决了诸多业界难题。

性能优势

PERFORMANCE ADVANTAGE

01 **微小样品检测**
最小测量面积可到0.008mm²

02 **变焦装置算法**
可改变测量距离测量凹凸异形样品，变焦距离0-90mm

03 **核心EFP算法**
Al(13)-U(92)元素的成分分析，Li(3)-U(92)元素的镀层检测，多层多元素甚至有同种同元素在不同层也可精准检测

04 **先进的解谱技术**
减少能量相近元素的干扰，降低检出限

05 **高性能探测器**
大窗口SDD硅漂移探测器

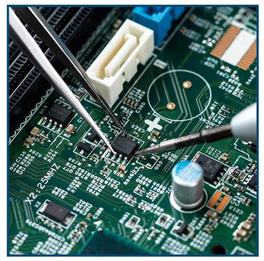
06 **X射线装置**
微焦加强型射线管搭配聚焦装置

07 **上照式设计**
实现对超大样品或者密集点位进行快、准、稳高效率测量

08 **大行程移动平台**
移动滑台100*150*145mm，可编程自动平台210*230*145mm（可定制600*600*145mm）

应用领域

APPLICATION FIELD

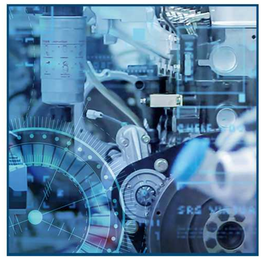

涂镀层分析

RoHS环保检测

地质地矿检测

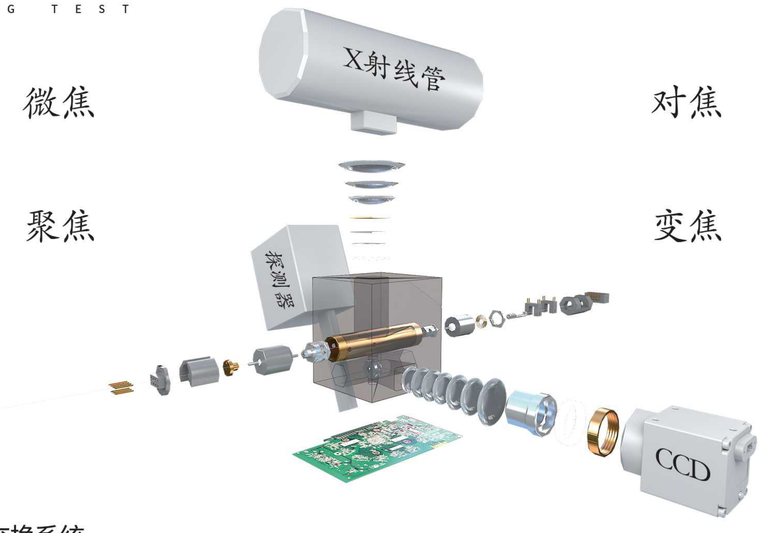
贵金属检测

合金成分分析


全元素分析

涂镀层检测

COATING TEST

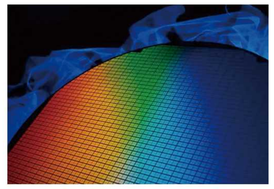


高集成光路交换系统

一六仪器研制的光谱仪独特的光路交换装置，让X射线和可见光摄向同一垂直线，达到测试不同距离的定位与视觉在同一位置，搭配嵌入集成式多准直孔、滤光片切换装置，X光扩散度极小；高集成的光路交换装置与接收器的角度可缩小一倍，可以减少弧度倾斜放样带来的误差，同时特征X射线可以穿透测试更厚的表层。

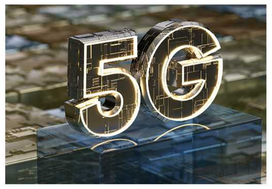
行业应用

INDUSTRY APPLICATION



半导体

新能源

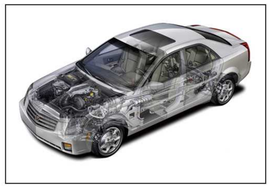


5G通信

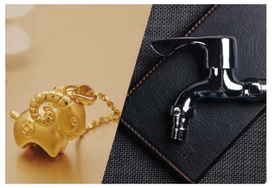
五金建材

航天航空

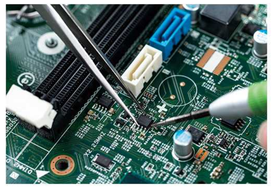
环保



汽车行业



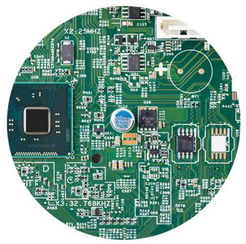
珠宝卫浴

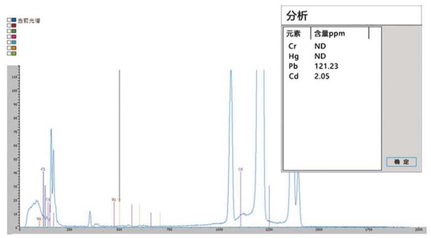


精密电子

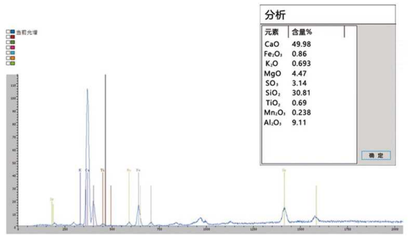
电镀行业

高精度微区RoHS检测

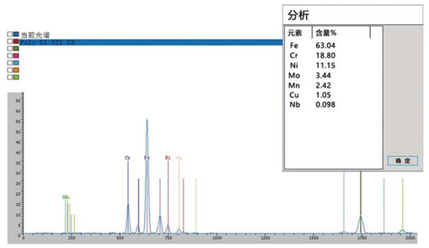




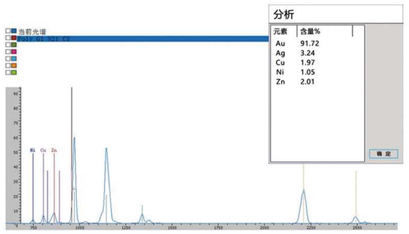
精密电子



地质地矿



合金分析



贵金属分析

自主研发新一代核心算法（EFP）

专业的研发团队在ALPHA和FP算法的基础上，计算样品中每个元素的一次荧光、二次荧光、靶材荧光、吸收增强效应、散射背景等多元优化迭代开发出EFP核心算法，结合光路交换系统、变焦结构设计及稳定的多道脉冲分析采集系统、强大的解谱技术，只要少量的标样来校正仪器因子，可测试各种材料成分分析、微量元素，超复杂的涂镀层、渗层以及有机物层的厚度及成分含量。

环保检测解决方案

- 欧盟RoHS指令-2011/65/EU
- 无卤指令[IEC61249-2-21]
- REACH指令
- 玩具En71指令
- 美国CPSIA消费品安全改进法
- China-RoHS国推自愿性认证
- IEC62321标准
- GB/T26125-2011

- 分析精度高
- 测量范围广
- 定位超精准
- 测试速度快
- 操作特智能

元素与指令对应关系

★标配　☆选配

管制对象											指令相关
	卤素		ELV / RoHS		CPSIA						
			EN71(玩具)								
元素	Cl	Br	Hg	Cr	Pb	Cd	Sb	As	Ba	Se	Sb Sn S
	★	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

型号
XAD/XAD-200

RoHS分析
有害元素检测(RoHS、卤素)最低检出限可达1ppm

EFP算法
标配

涂镀层分析
可同时分析23个镀层，24种元素，不同层有相同元素也可分析，可检测Li(3)-U(92)涂镀层90种元素

成分分析
用于地矿、合金及贵金属等物质中Al(13)-U(92)的80种元素成分分析

分析时间
1-200秒

软件操作
人性化封闭软件，自动判断故障提示校正及操作步骤，避免误操作

X射线装置
微聚焦加强型射线管

探测器
Si-Pin半导体探测器/SDD硅漂移探测器

光路交换器
高集成，最近测距光斑扩散度＜10%

准直器
□0.1*0.3mm/Φ0.2mm;Φ0.3/0.5mm;Φ1.2mm;Φ3mm;四准直器自动切换(可另外定制)

光路交换器
高集成，最近测距光斑扩散度＜10%

滤光片
四种滤光片自由切换

样品观测
1/2.7”彩色CCD，变焦功能

测量距离
具有距离补偿功能，可改变测量距离凹凸异形样品，变焦距离0-90mm

对焦方式
高敏感镜头，无感自动对焦

放大倍数
光学18-46X，数字放大20-200倍

仪器尺寸
550mm*760mm*635mm

Z轴移动范围
145mm

样品台移动方式
全自动高精度XY平台

可移动范围
210mm*230mm（可定制600mm*600mm）

仪器重量
120kg

其他附件
电脑一套、喷墨打印机、附件箱、十二元素片、电镀液测量杯(选配)、标准片(选配)

X射线标准
DIN ISO 3497、ASTM B 568和DIN 50987

我们的服务

OUR SERVICES

■ 仪器的品质保证

一六仪器公司保证所供货品均为我司生产的新品，品质优良，符合我方相关说明书的技术指标参数。

■ 仪器的安装调试

一六仪器公司将在发货后快速响应，在双方约定时间内高效率高质量地完成仪器的免费安装、调试和培训指导。

■ 仪器的保修期

一六仪器公司提供终身维修，软件免费升级。

■ 仪器的售后服务

一六仪器公司提供全国售后服务，团队将于4小时内快速响应，12~48个小时内派人上门维修和排除故障。

■ 技术的培训与支持

仪器安装现场为客户免费提供硬件、软件操作培训服务，使操作人员掌握仪器相关的使用和日常维护。